3.3.5 Эффект Холла в металлах

Радькин Кирилл Б01-005 8.10.21

В работе используются: электромагнит с источником питания, источник постоянного тока, микровольтметр $\Phi116/1$, амперметры, измеритель магнитной индукции Ш1-10, образцы из меди, серебра и цинка.

Экспериментальная установка: Электрическая схема установки для измерения ЭДС Холла представлена на рис. 1.

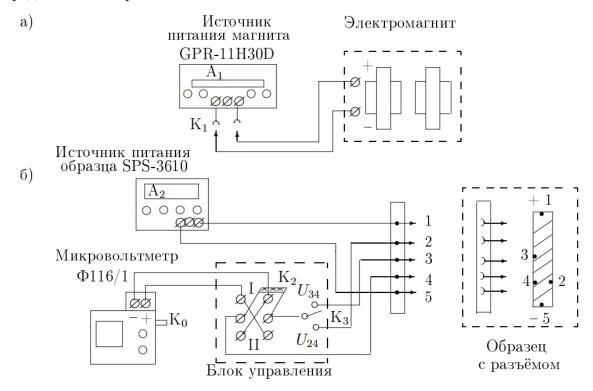


Рис. 1. Схема установки для исследования эффекта Холла в металлах

В зазоре электромагнита (рис. 1a) создается постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регуляторов тока источника питания. Ток питания электромагнита измеряется амперметром источника A_1 . Разъем K_1 позволяет менять направление тока в обмотках электромагнита.

Градуировка магнита проводится с помощью измерителя магнитной индукции (описание прибора расположено на установке).

Металлические образцы в форме тонких пластинок, смонтированные в специальных держателях, подключаются к блоку питания через разъем (рис. 16). Ток через образец регулируется ручками источника и измеряется амперметром источника A_2 .

В образце с током, помещенном в зазор электромагнита, между контактами 2 и 4 возникает холловская разность потенциалов, которая измеряется с помощью микровольтметра $\Phi 116/1$, если переключатель K_3 подключен к точке 2 образца. При подключении K_3 к точке 3 микровольтметр измеряет омическое падение напряжения U_{34} , вызванное основным током через образец. При нейтральном положении ключа входная цепь микровольтметра разомкнута.

Ключ K_2 позволяет менять полярность напряжения, поступающего на вход микровольтметра.

Иногда контакты 2 и 4 вследствие неточности подпайки не лежат на одной эквипотенциали, и тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения, вызванным протеканием основного тока через образец. Измеряемая разность потенциалов при одном направлении магнитного поля равна сумме ЭДС Холла и омического падения напряжения, а при другом — их разности. В этом случае ЭДС Холла ε_x может быть определена как половина алгебраической разности показаний вольтметра, полученных для двух противоположных направлений магнитного поля в зазоре.

Можно исключить влияние омического падения напряжения иначе, если при каждом токе через образец измерять напряжение между точками 2 и 4 в отсутствие магнитног поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение U_0 остается неизменным. От него следует (с учетом знака) отсчитывать величину ЭДС Холла: $\varepsilon_x = U_2 4 \pm U_0$. При таком способе измерения нет необходимости проводить повторные измерения с противоположным направлением магнитного поля.

По знаку ε_x можно определить характер проводимости — электронный или дырочный. Для этого необходимо знать направление тока в образце и направление магнитного поля.

Измерив ток I в образце и напряжение U_{34} между контактами 3 и 4 в отсутствие магнитного поля, можно, зная параметры образца, рассчитать проводимость материала образца по очевидной формуле.

$$\sigma = I \cdot L_{34} / \left(U_{34} \cdot a \cdot l \right) \tag{1}$$

где L_{34} — расстояние между контактами 3 и 4, a — толщина образца, l — его ширина.

Задание

В работе предлагается исследовать зависимость ЭДС Холла от величины магнитного поля при различных токах через образец для определения константы Холла; определить знак носителей заряда и проводимость различных Металлических образцов. Образец из серебра исследуется подробно; образец из цинка — по нескольким параметрам.

Градуировка электромагнита

1. С помощью прибора Ш1-10 исследуем зависимость индукции B магнитного поля в зазоре электромагнита от тока через магнит.

Проведем измерения магнитной индукции B для 6-8 значений тока через электромагнит I_M (вплоть до максимального I_M).

В, мТл		I						
I_M , A	0.16	0.32	0.48	0.64	0.80	0.96	1.12	1.22

Измерение ЭДС Холла

- 2. Вставим держатель с образцом в зазор электромагнита
- 3. Снимем зависимость напряжения U_{24} (включая U_0) от тока I_M через обмотки магнита при фиксированном (минимальном токе) через образец. Повторим измерения при различных токах через образец. (Для напряжения 75 делений это 3 мкв)

Серебряный образец:

$$U_0 = 3$$
 дел.

$$I_0 = 0.6A$$

U_{24} , дел.	6	7	10	12	15	16	17	19
I_M , A	0.16	0.32	0.48	0.64	0.80	0.96	1.12	1.22

$$I_0 = 0.9A$$

U_{24} , дел.	6	9	15	18	22	23	25	26
I_M, A	0.16	0.32	0.48	0.64	0.80	0.96	1.12	1.22

$$I_0 = 1.2A$$

U_{24} , дел.	8	14	19	23	28	30	32	33
I_M, A	0.16	0.32	0.48	0.64	0.80	0.96	1.12	1.22

Цинк:

$$U_0 = 12$$
 дел.

$$I_0 = 1 \text{ A}$$

U_{24} , дел.	19	26	31	38	43	45	47	48
I_M, A	0.16	0.32	0.48	0.64	0.80	0.96	1.12	1.22

Определение удельной проводимости

- 4. Выключим электромагнит
- 5. При токе через образец $\simeq 1$ А измерим падение напряжения между контактами 3 и 4 для каждого из двух образцов. Запишем параметры образцов, указанные на держателях

Цинк: $U_{34}=480$ мкв, $L_{34}=3.5$ мм, a=0.12 мм, l=9 мм

Серебро: $U_{34} = 380$ мкв, $L_{34} = 15$ мм, a = 0.09 мм, l = 11 мм

- 6. Построим график зависимости индукции магнитного поля от тока через магнит: $B = f(I_M)$
- 7. Рассчитаем ЭДС Холла и построим на одном листе семейство характеристик $\varepsilon_x = f(B)$ при разных значениях тока I через образец (для серебра).

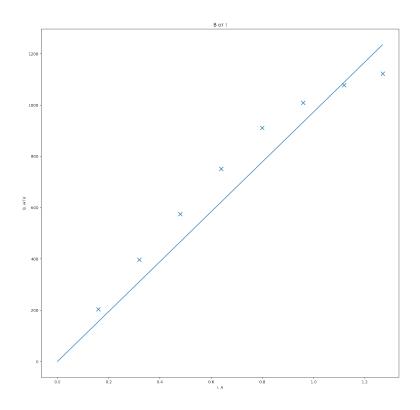
3

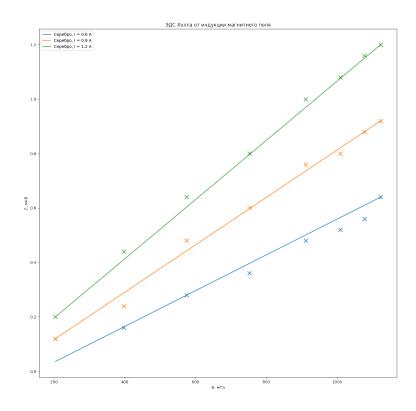
Определим угловые коэффициенты $K(I) = \Delta \varepsilon / \Delta B$ полученных прямых.

$$K1 = (6.5 \pm 0.3) \cdot 10^{-4} \frac{\text{MKB}}{\text{MTn}}$$

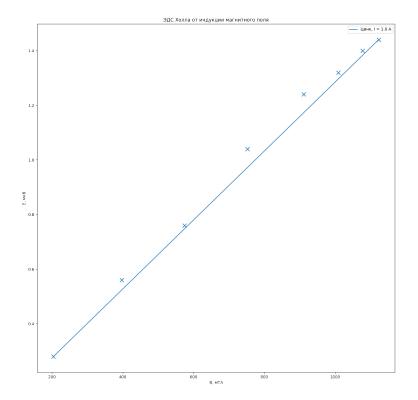
$$K2 = (5.8 \pm 0.3) \cdot 10^{-4} \frac{\text{мкB}}{\text{мТл}}$$

$$K2 = (5.4 \pm 0.2) \cdot 10^{-4} \frac{\text{MKB}}{\text{MT}}$$





8. Для цинка изобращим на графике зависимость $\varepsilon_x = f(B)$



9. Рассчитаем постоянные Холла для всех случаев:

$$R_{xs}(0.6 A) = (9.9 \pm 0.5) \cdot 10^{-11} \frac{\text{M}^3}{\text{K}\pi}$$

$$R_{xs}(0.9 A) = (8.7 \pm 0.4) \cdot 10^{-11} \frac{\text{M}^3}{\text{K}\pi}$$

$$R_{xs}(1.2 A) = (8.2 \pm 0.4) \cdot 10^{-11} \frac{\text{M}^3}{\text{K}\pi}$$

$$R_{xc}(1.0 A) = (-15.1 \pm 1.0) \cdot 10^{-11} \frac{\text{M}^3}{\text{K}\pi}$$

10. Рассчитаем концентрацию n носителей тока:

$$n_s = (15.8 \pm 1.2) \cdot 10^{30}$$

 $n_c = (24.2 \pm 3.1) \cdot 10^{30}$

11. Рассчитаем удельную проводимость σ материала образцов:

$$\sigma_s = (39.9 \pm 4.7) \cdot 10^6 \frac{1}{\text{OM} \cdot \text{M}}$$

$$\sigma_c = (6.7 \pm 0.1) \cdot 10^6 \frac{1}{\text{OM} \cdot \text{M}}$$